Оптическая спектроскопия экситонных состояний в CulnSe₂

© А.В. Мудрый[¶], М.В. Якушев[†], Р.Д. Томлинсон[†], А.Е. Хилл[†], Р.Д. Пилкингтон[†], И.В. Боднарь^{*}, И.А. Викторов, В.Ф. Гременок, И.А. Шакин, А.И. Патук

Институт физики твердого тела и полупроводников Национальной академии наук Белоруссии, 220072 Минск, Белоруссия [†]Сэлфордский университет, М5 4WT Сэлфорд, Англия *Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 220027 Минск, Белоруссия

(Получена 24 ноября 1999 г. Принята к печати 1 декабря 1999 г.)

В интервале температур 4.2–300 К исследованы оптические свойства структурно-совершенных монокристаллов CuInSe₂ с использованием фотолюминесценции, оптического поглощения, оптического отражения и оптического отражения с модуляцией по длине волны (ООМДВ). Обнаружены интенсивные линии свободных экситонов A (~ 1.0414 эВ) и B (~ 1.0449 эВ) с полушириной ~ 0.7 мэВ при 4.2 К, относящиеся к двум экстремумам валентной зоны, расщепленной кристаллическим полем. Обнаружены экситоны, дающие в спектрах ООМДВ линию C (~ 1.2779 эВ) и относящиеся к нижней валентной зоне, расщепленной спин-орбитальным взаимодействием. В рамках квазикубической модели Хоупфилда рассчитаны параметры расщепления валентной зоны $\Delta_{cf} = 5.2$ мэВ и $\Delta_{so} = 234.7$ мэВ, определяемые кристаллическим и спинорбитальным взаимодействием соответственно. В области края фундаментального поглощения обнаружены линии связанных экситонов с полушириной ~ 0.3 мэВ, что свидетельствует о высоком качестве выращенных кристаллов CuInSe₂.

1. Введение

Трехкомпонентное соединение CuInSe₂ (CIS) относится к группе полупроводников А^IВ^{III}С^{VI} и кристаллизуется в структуре халькопирита. Соединение CIS является прямозонным полупроводником с чрезвычайно большим коэффициентом оптического поглощения $\sim (3 \div 6) \cdot 10^7 \,\mathrm{m}^{-1}$ и считается перспективным материалом для изготовления высокоэффективных солнечных элементов [1]. К настоящему времени CIS — одно из наиболее исследованных соединений группы полупроводников А^IВ^{III}С₂^{VI}, однако многие его свойства, и прежде всего оптические, изучены недостаточно. В большинстве случаев данные о фундаментальных параметрах и энергетической зонной стуктуре CIS материала противоречивы или вообще отсутствуют. Особенно это касается экспериментальных данных о свободных и связанных состояниях экситонов и примесных оптических переходах в области края собственного поглощения [2-4]. Изучение свойств CIS до последнего времени ограничивалось отсутствием структурно-совершенных монокристаллов. Исследования проводились или на поликристаллах, или на монокристаллах невысокого структурного качества с маловоспроизводимыми параметрами. Лишь недавно в спектрах фотолюминесценции (ФЛ) поликристаллических тонких пленок были обнаружены линии 1.0398 и 1.0432 эВ, относящиеся к основному и возбужденному состояниям свободного экситона соответственно [3]. Близкие по энергии линии свободного экситона 1.039 и 1.045 эВ наблюдались в спектрах ФЛ пленок, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии [2]. Серия экситонных линий с более высокоэнергетическим, чем в [2,3], основным ~ 1.0408 эВ и возбужденным ~ 1.0446 эВ состояниями была обнаружена нами в спектре ФЛ монокристаллов СІЅ [4]. В данной работе мы приводим новые данные и даем переинтерпретацию экситонной люминесценции в высококачественных монокристаллах СІЅ. Впервые одновременно в спектрах ФЛ, оптического поглощения (ОП) и оптического отражения (ОО) разрешена структура A и B экситонов, связанных с двумя экстремумами валентной зоны, расщепленной кристаллическим полем в монокристаллах СІЅ.

2. Методика эксперимента

Образцы CIS высокого структурного совершенства р-типа проводимости были вырезаны из средней части слитков, выращенных методом Бриджмена (вертикальный вариант) в Сэлфордском университете. Оптические свойства монокристаллов CIS были исследованы с использованием ФЛ, ОП, ОО и оптического отражения с модуляцией по длине волны (ООМДВ) в температурном интервале 4.2-300 К. ФЛ наблюдалась со свежесколотых граней кристаллов. Измерения оптического поглощения были выполнены на тонких монокристаллах с толщиной ~ 2-3 мкм, погружаемых в свободном состоянии в жидкий гелий. Приготовление таких образцов осуществлялось механическим полированием с последующим химическим травлением в 1% растворе метанола брома. В качестве источника оптического возбуждения неравновесных носителей заряда в экспериментах по люминесценции использовался аргоновый лазер, работающий на длине волны 488 нм. В экспериментах по

[¶] Fax: (017)2840888

E-mail: mudriy@ifttp.bas-net.

поглощению и отражению света использовалась 100 Вт галогенная лампа с ленточным накалом. В качестве детектора использовался охлаждаемый до температуры жидкого азота Ge p-i-n-диод. Модуляция длины волны осуществлялась качанием плоскости зеркала с частотой 20 Гц вдоль вертикальной оси в монохроматоре МДР23. Энергетическое положение линий в спектрах ФЛ, ОП, ОО и ООМДВ определено с точностью ± 0.2 и ± 0.4 мэВ соответственно.

3. Экспериментальные результаты и их обсуждение

На рис. 1 представлены типичные спектры ФЛ, снятые при 4.2 К в области края фундаментального поглощения для трех образцов, вырезанных из разных слитков. Эксперименты показали, что для структурно-совершенных образцов, вырезанных либо из разных слитков, либо из различных частей одного и того же слитка, спектры ФЛ могут различаться, но в основном их вид сводится к трем типам, представленным на рис. 1, a-c. Как видно, в спектрах ФЛ может проявляться не менее 5 относительно интенсивных узких линий, обозначенных М1–М5. Энергетическое положение наиболее интенсивных линий люминесценции определено с точностью ± 0.0002 эВ и составляет: M1 - 1.0386, M2 - 1.0353, M3 - 1.0341, M4 - 1.0324 и M5 - 1.0278 эВ. Причем в



Рис. 1. Спектры фотолюминесценции для трех различных монокристаллов CIS (*a*, *b* и *c*). Температура измерений, К: *a*, *b*, *c* — 4.2, *c'* — 40. Спектральное разрешение 0.3 мэВ.

Физика и техника полупроводников, 2000, том 34, вып. 5

зависимости от технологических режимов выращивания кристаллов (различные слитки, образцы) относительная интенсивность линий М1-М5 в спектрах ФЛ может различаться существенным образом вплоть до того, что некоторые из них не регистрируются (см., например, Такой характер изменения относительрис. 1, *a*, *b*). ных интенсивностей линий от слитка к слитку или от кристалла к кристаллу позволяет считать, что они связаны с излучательной рекомбинацией неравновесных носителей заряда на различных по своей природе и структуре дефектно-примесных комплексах. Интенсивные узкие линии M1-M5 имеют полуширину ~ 0.3 мэВ при 4.2 К и она остается всегда меньше kT при изменении температуры в интервале 4.2-40 К. Интенсивность линий М1-М5 сильно падает при повышении температуры образца от 4.2 К, и при 40 К линии практически не обнаруживаются в спектрах ФЛ. С учетом этих экспериментальных фактов можно считать, что линии М1-М5 обусловлены бесфононными (чисто электронными) переходами, возникающими при излучательной аннигиляции экситонов, локализованных на соответствующих примесных центрах. Важно отметить, что наиболее интенсивные линии связанных экситонов М1 и М2 имеют узкие с полушириной ~ 0.3 мэВ коротковолновые компоненты *M*1′ — 1.396 эВ, *M*1″ — 1.0405 эВ и *M*2′ — 1.0359 эВ соответственно. Для компонент линий М1 и М2 характерно наличие "неводородоподобной" сходимости в высокоэнергетическую область спектра. При этом энергетический зазор между линиями неодинаковый, а именно $M1-M1' \sim 1.03$ мэВ, $M1'-M1'' \sim 0.85$ мэВ и $M2-M2' \sim 0.64$ мэВ, $M2'-M2'' \sim 0.45$ мэВ. Большее расщепление компонент характерно для центров, ответственных за линию М1, имеющих меньшую энергию связи экситонов по сравнению с М2 центрами. При повышении температуры от 4.2 К наблюдается перераспределение интенсивностей между компонентами линий М1 и М2 в соответствии с законом Больцмана. Это позволяет интерпретировать линии М1', М1" и М2', М2" как проявление возбужденных экситонных состояний центров М1 и М2 соответственно. Исходя из анализа спектров ФЛ и стехиометрического состава исследуемых образцов можно сделать несколько предположений относительно природы центров люминесценции. Наиболее вероятно, что линии M1-M5 возникают в результате аннигиляции связанных экситонов на различных нейтральных донорах и акцепторах, таких, например, как Cu_i , Cu_{In} , In_i и др., или атомах неконтролируемых остаточных примесей.

Наиболее важным экспериментальным фактом является существование двух высокоэнергетических линий, обозначенных нами A и B на рис. 1. Эксперименты показали, что энергетическое положение линий A и B не изменяется, а их интенсивность увеличивается практически линейно при увеличении интенсивности возбуждающего света в интервале от 0.2 до 20 Вт/см². При 4.2 К линии A и B имеют равную полуширину ~ 0.7 мэВ (~ 2 kT). Эксперименты показали, что интенсивность линий M1-M5 уменьшается намного быстрее, чем у



Рис. 2. Спектры фотолюминесценции монокристаллов CIS при различных температурах. Температура измерения, К: *a* — 300, *b* — 78, *c* — 4.2.

линий А и В при увеличении температуры. Принимая это во внимание, логично предположить, что низкоэнергетическая линия 1.0414 эВ обусловлена излучательной рекомбинацией свободных экситонов (А экситоны), а менее интенсивная высокоэнергетическая линия 1.0449 эВ (В) — свободных экситонов, относящихся к двум экстремумам валентной зоны, расщепленной из-за влияния некубического кристаллического поля в монокристаллах CIS. Температурный анализ энергетического положения линий М1-М5, А и В, их полуширины и интенсивностей в диапазоне температур от 4.2 до 300 К подтверждает эту интерпретацию. На рис. 2 для одного из образцов (см. спектры ФЛ этого образца также на рис. 1) представлены спектры ФЛ, снятые при различных температурах. Эксперименты показывают, что низкоэнергетические интенсивные линии М1-М5 полностью исчезают из спектров ФЛ при температурах 40-45 К, что связано с диссоциацией связанных экситонов, а линии А и В обусловлены аннигиляцией свободных экситонов и существуют в спектрах вплоть до комнатной температуры. Отсутствие линий M1-M5 в спектрах $\Phi\Pi$ при $T \sim 40$ K также отчетливо видно из данных, представленных для другого образца на рис. 1, с, с'. При 78 К в спектрах присутствуют только две слабо разрешаемые линии свободных экситонов $A ~(\sim 1.0426 \, \mathrm{sB})$ и $B ~(\sim 1.0459 \, \mathrm{sB})$ с полуширинами ~ 7 мэВ. Спектры ФЛ при 300 К состоят из одиночной полосы с максимумом 1.028 эВ и полушириной 40 мэВ, предствляющей собой контур от неразрешаемых А и В линий свободных экситонов (рис. 2). Эксперименты показали, что энергетическое положение линий М1-М5, А и В зависит от температуры. По мере увеличения температуры (в области < 80 К) все линии смещаются одинаковым образом в высокоэнергетическую область спектра и их взаимное энергетическое положение сохраняется. Это свидетельствует о том, что спектральное положение линий связанных экситонов *M*1-*M*5 определяется температурным смещением энергетических зонных состояний. В частности, установлено, что энергия основного экситонного состояния А увеличивается от значения ~ 1.0414 эВ при 4.2 К до значения 1.0426 эВ при 78 К и затем медленно уменьшается до 1.028 эВ при 300 К. Аналогичная температурная зависимость характерна для линии 1.0449 эВ, облусловленной В экситонами. Такое аномальное температурное изменение ширины запрещенной зоны Eg может быть обусловлено суммарным влиянием двух эффектов изменением постоянной решетки и электрон-фононным взаимодействием. Подобная температурная зависимость E_g была установлена для других халькопиритных полупроводниковых соединений — CuGaSe₂, AgInSe₂ и др. (см., например, [4-6]). В дополнение к измерениям ФЛ нами проведена регистрация спектров поглощения и отражения с высоким спектральным разрешением ~ 0.1 мэВ при низких температурах. Результаты этих экспериментов приведены на рис. 3. В спектрах ОП и ОО удалось отчетливо разрешить линии свободных



Рис. 3. Спектры фотолюминесценции (*a*), поглощения (*b*) и отражения (*c*) высококачественных монокристаллов CIS при 4.2 К. Спектральное разрешение 0.1 мэВ.

Физика и техника полупроводников, 2000, том 34, вып. 5

экситонов A и B, причем с точностью ± 0.0002 эВ их энергетическое положение соответствует данным люминесценции. Полуширина линий А и В в спектрах ОП и ОО оказалась $\sim 0.7 - 0.8$ мэВ при 4.2 K, что согласуется с данными по ФЛ. Установлено также, что линии А и B в ОП, ОО и ФЛ имеют одинаковую температурную зависимость энергетического положения в интервале 4.2-78 К. Третий экситонный переход С, обусловленный спин-орбитальным взаимодействием в CIS материале, из-за своей малой интенсивности был обнаружен нами только при измерении отражения с модуляцией длины волны. При 4.2 К энергетическое положение С экситона Эксперименты по измерению составляло 1.2779 эВ. поляризационной зависимости спектров при ориентации электрического вектора анализирующего поляризатора *E* || *Z* и *E* ⊥ *Z*, где *Z* — оптическая ось кристаллов CIS, показали соответствие наблюдаемых интенсивностей компонент А, В и С квазикубической модели [7,8]. Используя квазикубическую модель Хоупфилда по расщеплению трижды вырожденной валентной зоны с учетом влияния некубического (тетрагонального) кристаллического поля и спин-орбитального взаимодействия, мы рассчитали соответствующие параметры валентной зоны Δ_{CF} и Δ_{SO} [7,8]. В соответствии с этой моделью энергия уровней Γ_7 относительно энергии уровня Γ_6 для валентной зоны трехкомпонентных халькопиритных полупроводников описывается следующими уравнениями:

$$\Delta_{CF} = -1/2(E_1 + E_2) - 1/2[(E_1 + E_2)^2 - 6E_1E_2]^{1/2}, \quad (1)$$

$$\Delta_{SO} = -1/2(E_1 + E_2) + 1/2[(E_1 + E_2)^2 - 6E_1E_2]^{1/2}, \quad (2)$$

где Δ_{SO} — величина спин-орбитального расщепления валентной зоны в кубическом поле, Δ_{CF} — величина расщепления, обусловленная кристаллическим полем при отсутствии спин-орбитального расщепления, $E_1 = E_A - E_B$ и $E_2 = E_A - E_C$ — энергетические зазоры между двумя верхними и нижними валентными зонами соответственно [9,10]. Используя энергии для А, В и С переходов из наших экспериментов 1.0414, 1.0449 и 1.2779 эВ соответственно, из выражений (1) и (2) нами определены значения $\Delta_{CF} = 5.2$ мэВ и $\Delta_{SO} = 234.7$ мэВ. Отметим, что две линии А и В со значительно меньшими значениями энергии были обнаружены ранее в спектрах электроотражения CIS монокристаллов при 77 К [8]. Энергетический зазор между линиями был равен 3.8 мэВ, что согласуется удовлетворительно со значением 3.5 мэВ, найденным в наших экспериментах.

Необходимо отметить несколько важных обстоятельств. Во-первых, в экспериментах по ОП, ОО и ФЛ полуширина экситонных линий *A* и *B* составляла 0.7 мэВ при 4.2 K, что является на сегодняшний день наименьшей полушириной, подтвержденной для CIS-материала. Во-вторых, полуширина линий связанных экситонов *M*1-*M*5 была также мала и составляла 0.3 мэВ при 4.2 K. Известно, что при низких температурах (~ 1-4.2 K) в структурно-совершенных монокристаллах полупроводников (GaAs, ZnS, ZnSe, CdS, InSe и др.) типичная полуширина линий свободных и связанных экситонов составляет 0.7-1.0 и 0.1-0.3 мэВ соответственно. В-третьих, при 78 К в спектрах ФЛ монокристаллов CIS присутствуют только линии свободных экситонов. Эти экспериментальные факты свидетельствуют о структурном совершенстве исследованных нами монокристаллов CIS. Результаты, полученные в данной работе, предполагают другую интерпретацию линии В, а именно отнесение ее к свободным В экситонам, в отличие от ранее сделанного отнесения к первому возбужденному состоянию А экситонов [2-4]. В пользу такой интерпретации свидетельствуют следующие факты: 1) различная поляризация А и В линий, 2) необычно высокая интенсивность линии В по отношению к линии А ($I_A/I_B \approx 1/3$) в оптических спектрах. Если бы линия В относилась к первому возбужденному состоянию А экситонов, то, согласно теории экситонов, ее интенсивность составляла бы менее чем $I_A/8$ согласно выражению $I_n = n^{-3}[(E_{ex}^0 - E_g)/n^2kT]$, т.е. убывала бы быстрее, чем n^{-3} , где n — главное квантовое число.

4. Заключение

Таким образом, установлено, что для структурносовершенных монокристаллов CIS при низких температурах (< 40 K) спектры фотолюминесценции содержат хорошо разрешенные линии свободных и связанных экситонов с полуширинами, сопоставимыми по величине с аналогичными значениями для других высококачественных и хорошо изученных полупроводников. Из экспериментов по измерению поглощения и отражения впервые подтверждено существование расщепления валентной зоны CIS-материала из-за влияния некубического кристаллического поля. С использованием квазикубической модели Хоупфилда определены численные значения параметров $\Delta_{CF} = 5.2$ мэВ и $\Delta_{SO} = 234.7$ мэВ расщепления валентной зоны, обусловленные кристаллическим и спин-орбитальным расщеплением соответственно.

Работа выполнена при поддержке EPSRC (грант GR/L62757), INTAS (грант n^0 634) и Фонда фундаментальных исследований Республики Белоруссии (грант Ф98-201).

Список литературы

- [1] H.W. Schock. Sol. Energy Mater.: Solar Cells, 34, 19 (1994).
- [2] S. Niki, H. Shibata, P.J. Pons, A. Yamada, A. Obara, Y. Makita, T. Kurafuji, S. Chichibu, H. Nakanichi. Appl. Phys. Lett., 67, 1289 (1995).
- [3] J.H. Schon, V. alberts, E. Bucher. J. Appl. Phys., **81**, 2799 (1997).
- [4] A.V. Mudryi, I.V. Bodnar, V.F. Gremenok, I.A. Victorov, A.I. Patuk, I.A. Shakin. Sol. Energy Mater.: Solar Cells, 53, 247 (1988).
- [5] J.J. Binsma, L.J. Giling, J. Bloem. J. Luminesc., 27, 55 (1982).

- [6] V.A. Aliyev, G.D. Gusseinov, F.L. Mamedov, L.M. Chapanova. Sol. St. Commun., 59, 745 (1986).
- [7] J.J. Hopfield. J. Phys. Chem. Sol., 15, 97 (1960).
- [8] J.L. Shay, J.W. Wernick. Ternary Chalcopyrite Semiconductors. Growth, Electronic Properties and Applications (Pergamon Press, N.Y., 1975).
- [9] J.L. Shay, B. Tell. Surf. Sci., 37, 748 (1973).
- [10] N. Yamamoto, H. Horinaka, K. Okada, T. Miyauchi. Jap. J. Appl. Phys., 16, 1817 (1977).

Редактор В.В. Чалдышев

Optical spectroscopy of excitonic states in CuInSe₂

A.V. Mudryi, M.V. Yakushev[†], R.D. Tomlinson[†], A.E. Hill[†], R.D. Pilkington[†], I.V. Bodnar^{*}, I.A. Viktorov, V.F. Gremenok, I.A. Shakin, A.I. Patuk

Institute of Physics of Solids and Semiconductors, National Academy of Sciences of Belarus, 220072 Minsk, Belarus [†]University of Salford, M54WT Salford, UK *Belarussian State University of Informatics and Radioelectronics, 220027 Minsk, Belarus

Abstract The optical properties of the high-perfect CuInSe₂ single crystals employing photoluminescence, absorption, reflection and wavelength deriviate reflection measurements in wide range of temperatures from 4.2 to 300 K have been studied. The two intensive lines of free excitons at $\sim 1.0414 \text{ eV}$ (A) and at 1.0449 eV (B) with half-width of about 0.7 meV at 4.2 K have been detected. These two peaks A and B occur due to free excitons, which are connected with two crystal field split-off valence bands respectively. A third exciton that relates to the peak C, which is connected with lower spin-orbit split-off valence band, was observed at 1.2779 eV. From the energy separation of the peaks A, B and C the crystalfield and spin-orbit splitting of the valence bands were estimated to be 5.2 and 234.7 meV, respectively. In the near-band-edge region of the PL spectra the bound exciton related lines with half-width of about $\sim 0.3 \,\mathrm{meV}$ were observed. This fact indicates the highquality of grown CuInSe₂ single crystals.

554